3244US0/btm ED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OCT 30 2001 WA, et al. GAU: 2812 TC 2800 MAIL ROOM **EXAMINER:** FILED: August 27, 20 LISHING STOPPER FILM, PROCESS FOR PRODUCING THE SAME, AND FOR: CHANICAL POLISHING REQUEST FOR PRIORITY ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS WASHINGTON, D.C. 20231 SIR: ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number [US App No], filed [US App Dt], is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120. ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e). Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below. In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority: **COUNTRY** APPLICATION NUMBER MONTH/DAY/YEAR **JAPAN** 2000-257536 August 28, 2000 Certified copies of the corresponding Convention Application(s) are submitted herewith will be submitted prior to payment of the Final Fee were filed in prior application Serial No. filed were submitted to the International Bureau in PCT Application Number. Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304. OCTO O ZOOR ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and (B) Application Serial No.(s) are submitted herewith will be submitted prior to payment of the Final Fee Respectfully Submitted, OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C. WILLIAM E. BEAUMONT **REGISTRATION NUMBER 30,996**

Registration No.

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 10/98)

22850



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2000年 8月28日

MAY 0 6 2003 C

GROUP 1700

出願番号 Application Number:

特願2000-257536

出 顏 人 Applicant(s):

ジェイエスアール株式会社

RECEIVED

OCT -2 7802

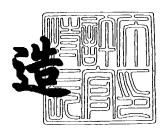
TECHNOLOGY CENTER 2800

To The Control of the

2001年 8月10日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

8945

【あて先】

特許庁長官殿

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエスアール

株式会社内

【氏名】

西川 通則

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエスアール

株式会社内

【氏名】

岡田 敬

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエスアール

株式会社内

【氏名】

山田 欣司

【特許出願人】

【識別番号】

000004178

【氏名又は名称】

ジェイエスアール株式会社

【代表者】

松本 栄一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

013066

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 化学機械研磨ストッパー

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 芳香族ポリアリーレンおよび芳香族ポリアリーレンエーテルもしくはいずれか一方ならびに

(B) 有機溶剤

を含有する溶液を塗布並びに焼成することにより得られる化学機械研磨ストッパ -。

【請求項2】 請求項1において、溶液が更に(C)ラジカル発生剤、重合性の二重結合を含有する化合物、重合性の三重結合を含有する化合物の群から選ばれる少なくとも1種の化合物を含有することを特徴とする化学機械研磨ストッパー。

【請求項3】 (A) 成分が下記一般式(1) で表される繰り返し構造単位を有する重合体および(2) で表される繰り返し構造単位を有する重合体もしくはいずれか一方であることを特徴とする請求項1記載の化学機械研磨ストッパー

一般式(1)

【化1】

$$(R^{7})_{b}$$
 $(R^{8})_{c}$ $(R^{9})_{d}$ $(R^{10})_{e}$ $(R^{11})_{f}$

一般式(2)

【化2】

 $(R^7 \sim R^{11}$ はそれぞれ独立して炭素数 $1 \sim 20$ の炭化水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数 $1 \sim 20$ のアルコキシル基、アリール基、またはハロゲン原子、Xは-CQQ'-(ここでQ、Q'は同一であっても異なっていてもよく、ハロゲ

ン化アルキル基、アルキル基、水素原子、ハロゲン原子またはアリール基を示す)に示す基、およびフルオレニレン基からなる群から選ばれる少なくとも1種であり、Yは-O-、-CO-、-COO-、-CONH-、-S-、-SO2-およびフェニレン基の群から選ばれた少なくとも1種であり、aは0または1を示し、b~fは0~4の整数を示し、gは5~100モル%、hは0~95モル%、iは0~95モル%(ただし、g+h+i=100モル%)、jは0~100モル%、kは0~100モル%(ただし、j+k=100モル%)

【請求項4】 (A) 成分が、重合体中に炭素数1~20の炭化水素基を含有することを特徴とする請求項1および請求項3記載の化学機械研磨ストッパー

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、化学機械研磨ストッパー膜に関する。更に詳しくは、本発明は、半導体装置の製造における配線パターンが設けられたウェハの化学機械研磨(以下、「CMP」ということもある。)において、 SiO_2 、フッ素ドープ SiO_2 、有機・無機SOG(Spin-onglass)材料などからなる層間絶縁膜や、SiN、Si-C、 SiO_2 などのバリア膜をCMP処理によるダメージから保護するためのストッパー膜に関する。

[0002]

【従来の技術】

半導体装置における層間絶縁膜やバリア膜等のCMPに用いられる研磨剤として、従来より、コロイダルシリカ及びコロイダルアルミナ等の無機粒子を含む水系分散体が多用されている。しかし、これらの水系分散体を用いるCMP処理を行うと、層間絶縁膜やバリア膜にスクラッチや膜剥がれが生じやすいという問題がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記の従来の問題を解決するものであり、層間絶縁膜やバリア膜な

どの上層に特定の塗膜を積層することで、CMPによる層間絶縁膜やバリア膜の ダメージを低減することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】

本発明は、

(A) 芳香族ポリアリーレンおよび芳香族ポリアリーレンエーテルもしくはいずれか一方ならびに(B) 有機溶剤を含有する溶液を塗布並びに焼成することにより得られる化学機械研磨ストッパーに関する。

[0005]

【発明の実施の形態】

(A) 成分

本発明の(A)成分は、芳香族ポリアリーレンおよび芳香族ポリアリーレンエーテルもしくはいずれか一方であり、下記一般式で表される繰り返し構造単位を有する重合体(以下「重合体(1)」という)および下記一般式(2)で表される繰り返し構造単位を有する重合体(以下「重合体(2)」という)が好ましい

一般式(1)

[0006]

【化3】

一般式(2)

【化4】

 $(R^7 \sim R^{11}$ はそれぞれ独立して炭素数 $1 \sim 20$ の炭化水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数 $1 \sim 20$ のアルコキシル基、アリール基、またはハロゲン原子、X

は-CQQ'-(22CQ,Q'は同一であっても異なっていてもよく、ハロゲン化アルキル基、アルキル基、水素原子、ハロゲン原子またはアリール基を示す)に示す基、およびフルオレニレン基からなる群から選ばれる少なくとも1種であり、Yは-O-、-COO-、-COO-、-CONH-、-S-、-SO2-およびフェニレン基の群から選ばれた少なくとも1種であり、aは0または1を示し、b~fは0~4の整数を示し、gは5~100モル%、hは0~95モル%、iは0~95モル%(ただし、g+h+i=100モル%)、jは0~100モル%、kは0~100モル%(ただし、j+k=100モル%)

なお、(A)成分を構成する重合体(1)および重合体(2)中には、炭素数 $1 \sim 20$ の炭化水素基を含有することが、塗膜の耐熱を向上させる面から好ましい。

また、重合体(1)および重合体(2)の繰り返し構造単位は、Xに対してパラ位で連結されているのが、高分子量の重合体が得られる面から好ましい。

[0007]

重合体(1);

式(1)で表される重合体は、例えば、下記式(3)に示す化合物を含むモノマーを遷移金属化合物を含む触媒系の存在下に重合することによって製造することができる。

[0008]

一般式(3)

【化5】

$$ZO_2SO_{-}$$
 $(R^7)_b (R^8)_c$ $X-[-]$ OSO_2Z

(式中、R7 ,R8 はそれぞれ独立して炭素数 $1 \sim 20$ の炭化水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数 $1 \sim 20$ のアルコキシル基、アリール基またはハロゲン原子、Xは-CQQ'-(ここで、Q, Q' は同一であっても異なっていてもよく、ハロゲン化アルキル基、アルキル基、水素原子、ハロゲン原子またはアリール基を示す)に示す基、およびフルオレニレン基からなる群から選ばれる少なくとも 1 種であり、b, c は $0 \sim 4$ の整数を示し、Z はアルキル基、ハロゲン化ア

ルキル基またはアリール基を示す。)

[0009]

上記一般式式(3)中のXを構成するQ,Q'のうち、アルキル基としては、メチル基、エチル基、iープロピル基、nープロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基など;ハロゲン化アルキル基としては、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基など;アリールアルキル基としては、ベンジル基、ジフェニルメチル基など;アリール基としては、フェニル基、ビフェニル基、トリル基、ペンタフルオロフェニル基などを挙げることができる。

[0010]

また、上記式(3)中の、-OSO2 Zを構成するZとしては、アルキル基として、メチル基、エチル基など;ハロゲン化アルキル基としては、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基など;アリール基としては、フェニル基、ビフェニル基、p-トリル基、p-ペンタフルオロフェニル基などを挙げることができる。

上記一般式 (3) 中のXとしては、下記一般式 (4) \sim (9) に示す 2 価の基が好ましい。

これらのうちでは、一般式 (9) に示すフルオレニレン基がさらに好ましい。

一般式(4)

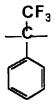
【化6】

一般式(5)

【化7】

一般式(6)

【化8】



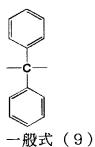
一般式(7)

【化9】

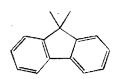


一般式(8)

【化10】



【化11】



[0012]

上記一般式(3)に示す化合物(モノマー)の具体例としては、例えば、

2, 2-ビス(4-メチルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、

ビス (4-メチルスルフォニロキシフェニル) メタン、

ビス (4-メチルスルフォニロキシフェニル) ジフェニルメタン、

特2000-257536

- 2, 2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、
- 2, 2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)へキ サフルオロプロパン、
- 2, 2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3, 5-ジメチルフェニル)へ キサフルオロプロパン、
 - 2, 2-ビス(4-メチルスルフォニロキシフェニル)プロパン、
 - 2,2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル)プロパン
- 2, 2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3, 5-ジメチルフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-フルオロフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3, 5-ジフルオロフェニル) プロパン、
 - 2, 2-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)プロパン
- 2, 2-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)プロパン、
 - 2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシー3, 5-ジメチルフェニル) プロパン、
 - 2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-フルオロフェニル)ジフ

ェニルメタン、

- 2, 2-ビス (p-トリルスルフォニロキシフェニル) プロパン、
- 2, 2-ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル) プロパン
- 2, 2-ビス(p-トリルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(p-トリルスルフォニロキシ-3, 5-ジメチルフェニル)プロパン、
 - 2, 2-ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル) プロパン
- 2, 2-ビス(p-トリルスルフォニロキシ-3, 5-ジメチルフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス (p-トリルスルフォニロキシー3-プロペニルフェニル) プロパン、

- 9, 9-ビス(4-メチルスルフォニロキシフェニル)フルオレン、
- 9,9-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル)フルオレン、
- 9, 9-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3, 5-ジメチルフェニル)フ ルオレン、
- 9, 9-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)フル オレン、
- 9, 9-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-フェニルフェニル)フルオ レン、

ビス (4-メチルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル) ジフェニルメタン

ビス (4 - メチルスルフォニロキシ-3, 5 - ジメチルフェニル) ジフェニル メタン、 ビス (4-メチルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル) ジフェニルメタン、

ビス (4-メチルスルフォニロキシ-3-フルオロフェニル) ジフェニルメタン、

ビス(4 - メチルスルフォニロキシ-3, 5 - ジフルオロフェニル)ジフェニルメタン、

9, 9-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-フルオロフェニル)フルオレン、

9, 9-ビス(4-メチルスルフォニロキシー3, 5-ジフルオロフェニル) フルオレン、

ビス(4-メチルスルフォニロキシフェニル)メタン、

ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル)メタン、

ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3,5-ジメチルフェニル)メタン、

ビス (4-メチルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル) メタン、

ビス (4-メチルスルフォニロキシフェニル) トリフルオロメチルフェニルメタン、

ビス(4-メチルスルフォニロキシフェニル)フェニルメタン、

2, 2-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフ ルオロプロパン、

ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)メタン、

ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニルメタン

2, 2-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3-メチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、

2, 2-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、

2, 2-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3, 5-ジメチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、

9, 9-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)フルオレ

ン、

- 9,9-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3-メチルフェニル)フルオレン、
- 9, 9-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3, 5-ジメチルフェニル)フルオレン、
- 9,9-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)フルオレン、
- 9, 9-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシ-3-フェニルフェ ニル)フルオレン、
- ビス (4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3-メチルフェニル) ジフェニルメタン、
- ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3,5-ジメチルフェニル)ジフェニルメタン、
- ビス (4-トリフルオロメチルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル) ジフェニルメタン、
- ビス (4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3-フルオロフェニル) ジフェニルメタン、
- ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3,5-ジフルオロフェニル)ジフェニルメタン、
- 9, 9-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシ-3-フルオロフェ ニル)フルオレン、
- 9, 9-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3, 5-ジフルオロフェニル)フルオレン、
 - ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)メタン、
- ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3-メチルフェニル)メタン、
- ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシ-3,5-ジメチルフェニル)メタン、
 - ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3-プロペニルフェニル)

メタン、

ビス (4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル) トリフルオロメチ ルフェニルメタン、

ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)、

2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロ パン、

ビス(4-フェニルスルフォニロキシフェニル)メタン、

ビス (4-フェニルスルフォニロキシフェニル) ジフェニルメタン、

- 2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、
- 2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)へ キサフルオロプロパン、
- 2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3, 5-ジメチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、
 - 9, 9-ビス(4-フェニルスルフォニロキシフェニル)フルオレン、
- 9, 9-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル)フルオ レン、
- 9, 9-ビス(4-フェニルスルフォニロキシー3, 5-ジメチルフェニル) フルオレン、
- 9, 9-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)フ ルオレン、
- 9, 9-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-フェニルフェニル)フルオレン、

ビス (4-フェニルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル) ジフェニルメタン、

ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3,5-ジメチルフェニル)ジフェニルメタン、

ビス (4 - フェニルスルフォニロキシ-3 - プロペニルフェニル) ジフェニル メタン、

特2000-257536

ビス (4-フェニルスルフォニロキシ-3-フルオロフェニル) ジフェニルメタン、

ビス (4-フェニルスルフォニロキシ-3, 5-ジフルオロフェニル) ジフェニルメタン、

9, 9-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-フルオロフェニル)フルオレン、

9, 9-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3, 5-ジフルオロフェニル)フルオレン、

ビス (4-フェニルスルフォニロキシフェニル) メタン、

ビス (4-フェニルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル) メタン、

ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3,5-ジメチルフェニル)メタン、

ビス (4-フェニルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル) メタン、

ビス (4-フェニルスルフォニロキシフェニル) トリフルオロメチルフェニル メタン、

ビス (4-フェニルスルフォニロキシフェニル) フェニルメタン、

2, 2-ビス (p-トリルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、

ビス (p-トリルスルフォニロキシフェニル) メタン、

ビス (p-トリルスルフォニロキシフェニル) ジフェニルメタン、

2, 2-ビス(p-トリルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、

2, 2-ビス(p-トリルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)へキ サフルオロプロパン、

2, 2-ビス(p-トリルスルフォニロキシ-3, 5-ジメチルフェニル)へ キサフルオロプロパン、

9, 9-ビス (p-トリルスルフォニロキシフェニル) フルオレン、

9, 9-ビス(p-トリルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル)フルオレン、

9, 9-ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3, 5-ジメチルフェニル)フ

ルオレン、

9, 9-ビス(p-トリルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)フルオレン、

9, 9-ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3-フェニルフェニル) フルオレン、

ビス (p-トリルスルフォニロキシー3-メチルフェニル) ジフェニルメタン

ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3, 5-ジメチルフェニル) ジフェニル メタン、

ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル) ジフェニルメタン、

ビス (p-トリルスルフォニロキシー3-フルオロフェニル) ジフェニルメタン、

ビス (p-トリルスルフォニロキシー3,5-ジフルオロフェニル)ジフェニルメタン、

9, 9-ビス (p-トリルスルフォニロキシー3-フルオロフェニル) フルオレン、

9, 9-ビス(p-トリルスルフォニロキシー3, 5-ジフルオロフェニル) フルオレン、

ビス (p-トリルスルフォニロキシフェニル) メタン、

ビス(p-トリルスルフォニロキシー3-メチルフェニル)メタン、

ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3, 5-ジメチルフェニル) メタン、

ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル) メタン、

ビス(pートリルスルフォニロキシフェニル)トリフルオロメチルフェニルメタン、

ビス (p-トリルスルフォニロキシフェニル) フェニルメタン などを挙げることができる。

本発明においては、上記一般式(3)に示す化合物を2種以上共重合すること もできる。

[0013]

上記一般式(3)に示す化合物は、例えば、下記の製法によって合成することができる。

すなわち、ビスフェノール化合物〔例えば、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパン〕およびビスフェノール化合物の2当量以上の塩基を溶媒に溶かす。このとき、ピリジンなどを溶媒として用いて、溶媒と塩基との両方の役割を兼用させてもよい。また、必要に応じて、4ージメチルアミノピリジンなどの触媒を加えてもよい。

[0014]

次いで、スルフォン酸クロライド(無水物)(例えば、メタンスルフォン酸クロライド)を15℃以下に保持しながら、5~60分かけて乾燥窒素気流下に滴下する。その後、その温度で0~60分攪拌したのち、室温に戻し、0~24時間攪拌し、懸濁液を作成する。得られた懸濁液を3~20倍量の氷水に再沈殿させ、その沈殿を回収し、再結晶などの操作を繰り返して、結晶としてビススルフォネート化合物を得ることができる。

[0015]

あるいは、まず、ビスフェノール化合物 [例えば、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン] を水酸化ナトリウム水溶液などの2当量のアルカリ水溶液に溶かす。その一方、スルフォン酸クロライド(無水物) (例えば、メタンスルフォン酸クロライド) をトルエン、クロロホルムなどの有機溶媒に溶かす。次いで、これらに必要に応じてアセチルトリメチルアンモニウムクロライドなどの相間移動触媒を加えたのち、激しく攪拌する。その後、反応して得られた有機層を精製することによっても、目的のビススルフォネート化合物を得ることができる。

[0016]

本発明においては、上記一般式(3)に示す化合物の少なくとも1種と、下記一般式(10) \sim (11)に示す化合物からなる群から選ばれる少なくとも1種とを共重合させてもよい。

[0017]

一般式(10)

【化12】

$$(R^9)_d$$
 $(R^{10})_e$ $(Y)_a$ $(Y)_a$

[0018]

「一般式 (10) 中、R9 ~R10はそれぞれ独立して炭素数1~20の炭化水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数1~20のアルコキシル基、アリール基またはハロゲン原子、R12~R13は、-OSO2 Z (ここで、Zはアルキル基、ハロゲン化アルキル基またはアリール基を示す。)、塩素原子、臭素原子または沃素原子を示し、Yは-O-、-CO-、-COO-、-CONH-、-SO2 一およびフェニレン基の群から選ばれた少なくとも1種であり、aは0または1を示し、d、eは0~4の整数を示す。]

[0019]

R9 ~R10のうち、ハロゲン原子としては、フッ素原子など、1価の有機基としては、アルキル基として、メチル基、エチル基など、ハロゲン化アルキル基として、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基など、アリル基として、プロペニル基など、アリール基として、フェニル基、ペンタフルオロフェニル基などを挙げることができる。また、-OSO2 Zを構成するZとしては、アルキル基として、メチル基、エチル基など、ハロゲン化アルキル基として、トリフルオロメチル基など、アリール基として、フェニル基、p-トリル基、p-フルオロフェニル基などを挙げることができる。

[0020]

上記一般式(10)に示す化合物としては、例えば、

- 4, 4'-ジメチルスルフォニロキシビフェニル、
- 4,4'-ジメチルスルフォニロキシ-3,3'-ジプロペニルビフェニル、
- 4, 4'-ジブロモビフェニル、4, 4'-ジヨードビフェニル、
- 4,4'-ジメチルスルフォニロキシー3,3'-ジメチルビフェニル、
- 4, 4′ージメチルスルフォニロキシー3, 3′ージフルオロビフェニル、

- 4, 4' ジメチルスルフォニロキシー3, 3', 5, 5' テトラフルオロビフェニル、
 - 4, 4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル、
 - 4, 4-メチルスルフォニロキシオクタフルオロビフェニル、
- - 4, 4'ージクロロー2, 2'ートリフルオロメチルビフェニル、
 - 4,4'ージブロモー2,2'ートリフルオロメチルビフェニル、

ビス(4-クロロフェニル)スルフォン、

- 4, 4'ージクロロベンゾフェノン、
- 2, 4-ジクロロベンゾフェノン

などを挙げることができる。

上記一般式(10)に示す化合物は、1種単独で、または2種以上を組み合わせて用いることができる。

一般式(11)

【化131

$$R^{14}$$
-R¹⁵

[0022]

[一般式(11)中、R11は、炭素数1~20の炭化水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数1~20のアルコキシル基、アリール基またはハロゲン原子、R14~R15は、-OSO2 Z(ここで、Zはアルキル基、ハロゲン化アルキル基またはアリール基を示す。)、塩素原子、臭素原子または沃素原子を示し、fは0~4の整数を示す。]

[0023]

R11のうち、ハロゲン原子としては、フッ素原子など、1価の有機基として

は、アルキル基として、メチル基、エチル基など、ハロゲン化アルキル基として、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基など、アリル基として、プロペニル基など、アリール基として、フェニル基、ペンタフルオロフェニル基などを挙げることができる。また、一〇S〇2 Zを構成するZとしては、アルキル基として、メチル基、エチル基など、ハロゲン化アルキル基として、トリフルオロメチル基など、アリール基として、フェニル基、pートリル基、pーフルオロフェニル基などを挙げることができる。

[0024]

上記一般式(11)に示す化合物としては、例えば、

o - ジクロロベンゼン、o - ジブロモベンゼン、o - ジヨードベンゼン、o -ジメチルスルフォニロキシベンゼン、2,3-ジクロロトルエン、2,3-ジブ ロモトルエン、2,3-ジョードトルエン、3,4-ジクロロトルエン、3,4 ージブロモトルエン、3,4ージヨードトルエン、2,3ージメチルスルフォニ ロキシベンゼン、3,4-ジメチルスルフォニロキシベンゼン、m-ジクロロベ ンゼン、m-ジブロモベンゼン、m-ジヨードベンゼン、m-ジメチルスルフォ ニロキシベンゼン、2,4-ジクロロトルエン、2,4-ジブロモトルエン、2 , 4 - ジヨードトルエン、3, 5 - ジクロロトルエン、3, 5 - ジブロモトルエ ン、3,5-ジョードトルエン、2,6-ジクロロトルエン、2,6-ジブロモ トルエン、2,6-ジヨードトルエン、3,5-ジメチルスルフォニロキシトル エン、2,6-ジメチルスルフォニロキシトルエン、2,4-ジクロロベンゾト リフルオライド、2, 4-ジブロモベンゾトリフルオライド、2, 4-ジヨード ベンゾトリフルオライド、3,5-ジクロロベンゾトリフルオライド、3,5-ジブロモトリフルオライド、3,5-ジヨードベンゾトリフルオライド、1,3 - ジブロモー 2, 4, 5, 6 - テトラフルオロベンゼン、2, 4 - ジクロロベン ジルアルコール、3,5-ジクロロベンジルアルコール、2,4-ジブロモベン ジルアルコール、3,5-ジブロモベンジルアルコール、3,5-ジクロロフェ ノール、3,5-ジブロモフェノール、3,5-ジクロローtーブトキシカルボ ニロキシフェニル、3,5-ジブロモーtーブトキシカルボニロキシフェニル、 2, 4-ジクロロ安息香酸、3, 5-ジクロロ安息香酸、2, 4-ジブロモ安息

上記一般式(11)に示す化合物は、1種単独で、または2種以上を組み合わせて用いることができる。

[0025]

重合体(1)中の繰り返し構造単位の割合は、上記一般式(1)において、gは $5\sim100$ モル%、好ましくは $5\sim95$ モル%、hは $0\sim95$ モル%、好ましくは $0\sim90$ モル%、iは $0\sim95$ モル%、好ましくは $0\sim90$ モル%(ただし、g+h+i=100モル%)である。

gが5モル%未満(hまたはiが95モル%を超える)では、重合体の有機溶剤への溶解性が劣る場合がある。

[0026]

重合体(1)を製造する際に用いられる触媒は、遷移金属化合物を含む触媒系が好ましく、この触媒系としては、①遷移金属塩および配位子、または配位子が配位された遷移金属(塩)、ならびに②還元剤を必須成分とし、さらに、重合速度を上げるために、「塩」を添加してもよい。

[0027]

ここで、遷移金属塩としては、塩化ニッケル、臭化ニッケル、ヨウ化ニッケル、ニッケルアセチルアセトナートなどのニッケル化合物、塩化パラジウム、臭化パラジウム、ヨウ化パラジウムなどのパラジウム化合物、塩化鉄、臭化鉄、ヨウ化鉄などの鉄化合物、塩化コバルト、臭化コバルト、ヨウ化コバルトなどのコバルト化合物などを挙げることができる。これらのうち、特に塩化ニッケル、臭化ニッケルなどが好ましい。

[0028]

また、配位子としては、トリフェニルホスフィン、 2, 2'ービピリジン、 1, 5 - シクロオクタジエン、 1, 3 - ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンなどを挙げることができるが、トリフェニルホスフィン、 2, 2'ービピリジンが好ましい。上記配位子は、 1 種単独でまたは 2 種以上を組合わせて用いることができる。

[0029]

さらに、あらかじめ配位子が配位された遷移金属(塩)としては、例えば、塩化ニッケル2トリフェニルホスフィン、臭化ニッケル2トリフェニルホスフィン、ヨウ化ニッケル2トリフェニルホスフィン、硝酸ニッケル2ートリフェニルホスフィン、塩化ニッケル2, 2′ビピリジン、臭化ニッケル2, 2′ビピリジン、ゴウ化ニッケル2, 2′ビピリジン、硝酸ニッケル2, 2′ビピリジン、ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスフィン)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウムなどを挙げることができるが、塩化ニッケル2トリフェニルホスフィン、塩化ニッケル2, 2′ビピリジンが好ましい。

[0030]

このような触媒系において使用することができる上記還元剤としては、例えば、鉄、亜鉛、マンガン、アルミニウム、マグネシウム、ナトリウム、カルシウムなどを挙げることできるが、亜鉛、マンガンが好ましい。これらの還元剤は、酸や有機酸に接触させることにより、より活性化して用いることができる。

[0031]

また、このような触媒系において使用することのできる「塩」としては、フッ化ナトリウム、塩化ナトリウム、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、硫酸ナトリウムなどのナトリウム化合物、フッ化カリウム、塩化カリウム、臭化カリウム、ヨウ化カリウム、硫酸カリウムなどのカリウム化合物、フッ化テトラエチルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニウム、硫酸テトラエチルアンモニウムなどのアンモニウム化合物などを挙げることができるが、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム

、臭化カリウム、臭化テトラエチルアンモニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニ ウムが好ましい。

[0032]

このような触媒系における各成分の使用割合は、遷移金属塩または配位子が配位された遷移金属(塩)が、上記一般式(3)、(10)~(11)の化合物の総量1モルに対し、通常、0.0001~10モル、好ましくは0.01~0.5モルである。0.0001モル未満であると、重合反応が充分に進行せず、一方、10モルを超えると、分子量が低下することがある。

[0033]

このような触媒系において、遷移金属塩および配位子を用いる場合、この配位子の使用割合は、遷移金属塩1モルに対し、通常、0.1~100モル、好ましくは1~10モルである。0.1モル未満では、触媒活性が不充分となり、一方、100モルを超えると、分子量が低下するという問題がある。

[0034]

また、触媒系における還元剤の使用割合は、上記一般式(3)、(10)~(11)の化合物の総量1モルに対し、通常、0.1~10モル、好ましくは1~10モルである。0.1モル未満であると、重合が充分進行せず、一方、100モルを超えると、得られる重合体の精製が困難になることがある。

[0035]

さらに、触媒系に「塩」を使用する場合、その使用割合は、上記一般式(3)、(10)~(11)の化合物の総量1モルに対し、通常、0.001~100 モル、好ましくは0.01~1モルである。0.001モル未満であると、重合 速度を上げる効果が不充分であり、一方、100モルを超えると、得られる重合 体の精製が困難となることがある。

[0036]

本発明で使用することのできる重合溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、ジメチルスルホキシド、N, N – ジメチルホルムアミド、N, N – ジメチルアセトアミド、1 – メチルー 2 – ピロリドン、 γ – ブチロラクトン、 γ – ブチロラクタムなどを挙げることができ、テトラヒドロフラン、N

, N − ジメチルホルムアミド、N , N − ジメチルアセトアミド、1 − メチルー 2 − ピロリドンが好ましい。これらの重合溶媒は、充分に乾燥してから用いることが好ましい。

[0037]

重合溶媒中における上記一般式 (3)、(10) ~ (11) の化合物の総量の 濃度は、通常、1 ~ 100 重量%、好ましくは 5 ~ 40 重量%である。

[0038]

また、上記重合体を重合する際の重合温度は、通常、 $0\sim200$ $\mathbb C$ 、好ましくは $50\sim80$ $\mathbb C$ である。また、重合時間は、通常、 $0.5\sim100$ 時間、好ましくは $1\sim40$ 時間である。

なお、上記重合体(1)のポリスチレン換算の重量平均分子量は、通常、1,000~1,000,000である。

[0039]

重合体(2);

一般式(2)で表される重合体は、例えば、下記一般式(12)~(14)に示す化合物を含むモノマーを触媒系の存在下に重合することによって製造することができる。

[0040]

一般式(12)

【化14】

$$R^{16}$$
 X R^{17}

[0041]

[-般式(12)中、 R^7 、 R^8 はそれぞれ独立して炭素数 $1\sim 20$ の炭化水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数 $1\sim 20$ のアルコキシル基、アリール基またはハロゲン原子、Xは-CQQ' - (ここでQ、Q' は同一であっても異なっていてもよく、ハロゲン化アルキル基、アルキル基、水素原子、ハロゲン原子またはアリール基を示す)に示す基、およびフルオレニレン基からなる群から選ばれる少

なくとも1種であり、b、cは0~4の整数を示し、 R^{16} は、 R^{17} は水酸基、ハロゲン原子、-OM基(Mはアルカリ金属である)からなる群から選ばれる少なくとも1種を示す。]

[0042]

前記一般式(12)に示す化合物(モノマー)の具体例としては、例えば

2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパン、

ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、

ビス(4-ヒドロキシフェニル)ジフェニルメタン、

- 2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、
- 2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3-プロペニルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、
- 2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3, 5-ジメチルフェニル) ヘキサフルオロ プロパン、
 - 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、
 - 2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)プロパン、
 - 2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3-プロペニルフェニル)プロパン、
 - 2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)プロパン、
 - 2.2-ビス(4-ヒドロキシ-3-フルオロフェニル)プロパン、
 - 2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3, 5-ジフルオロフェニル)プロパン、

ビス(4-クロロフェニル)メタン、

ビス(4-クロロフェニル)ジフェニルメタン、

- 2, 2-ビス(4-クロロ-3-メチルフェニル)へキサフルオロプロパン、
- 2, 2-ビス(4-クロロ-3-プロペニルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、
- 2, 2-ビス(4-クロロー3, 5-ジメチルフェニル) ヘキサフルオロプロ パン、
 - 2, 2-ビス(4-クロロフェニル)プロパン、

特2000-257536

- 2, 2-ビス(4-クロロ-3-メチルフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(4-クロロ-3-プロペニルフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(4-クロロ-3, 5-ジメチルフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(4-クロロ-3-フルオロフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(4-クロロ-3, 5-ジフルオロフェニル)プロパン、
- 2, 2-ビス(4-クロロフェニル)へキサフルオロプロパン、
- ビス(4-ブロモフェニル)メタン、
- ビス(4-ブロモフェニル)ジフェニルメタン、
- 2 ビス(4 ブロモー3 メチルフェニル)へキサフルオロプロパン、
- 2, 2-ビス(4-ブロモー3-プロペニルフェニル)へキサフルオロプロパン、
- 2, 2-ビス(4-ブロモ-3, 5-ジメチルフェニル) ヘキサフルオロプロ パン、
 - 2, 2-ビス(4-ブロモフェニル)プロパン、
 - 2, 2-ビス(4-ブロモ-3-メチルフェニル)プロパン、
 - 2、2-ビス(4-ブロモ-3-プロペニルフェニル)プロパン、

 - 2, 2-ビス(4-ブロモー3-フルオロフェニル)プロパン、
 - 2, 2-ビス(4-ブロモ-3, 5-ジフルオロフェニル)プロパン、
 - ビス(4-フルオロフェニル)メタン、
 - ビス(4-フルオロフェニル)ジフェニルメタン、
 - 2, 2-ビス(4-フルオロ-3-メチルフェニル)へキサフルオロプロパン
- 2, 2-ビス(4-フルオロ-3-プロペニルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、
- 2, 2-ビス(4-フルオロ-3, 5-ジメチルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、
 - 2, 2-ビス(4-フルオロフェニル)プロパン、
 - 2, 2-ビス(4-フルオロ-3-メチルフェニル)プロパン、

- 2, 2-ビス(4-フルオロ-3-プロペニルフェニル)プロパン、
- $2, 2 \forall \lambda (4 \lambda \lambda) (4$
- 2, 2-ビス(4-フルオロー3-フルオロフェニル)プロパン、

2, 2-ビス(4-フルオロ-3, 5-ジフルオロフェニル)プロパンなどを挙げることができる。上記ビスフェノール化合物はナトリウム、カリウムなどを含有する塩基性化合物によって、水酸基を-OM基(Mはアルカリ金属である)に置換させても良い。

本発明においては、前記一般式(12)に示す化合物を2種以上共重合することもできる。

[0043]

一般式(13)

【化15】

$$R^{18}$$
 $(Y)_a$ $(R^{10})_e$

[0044]

[一般式(13)中、 R^9 、 R^{10} はそれぞれ独立して炭素数 $1\sim 20$ の炭化水素基、シアノ基、ニトロ基、炭素数 $1\sim 20$ のアルコキシル基、アリール基またはハロゲン原子、 R^{18} は、 R^{19} は水酸基、ハロゲン原子、-OM基(Mはアルカリ金属である)からなる群から選ばれる少なくとも 1 種を示し、Yは-O-、-COO-、-CONH-、<math>-S-、-SO2-およびフェニレン基の群から選ばれた少なくとも 1 種であり、a は 0 または 1 を示し、d,e は $0\sim 4$ の整数を示す。]

[0045]

前記一般式(13)に示す化合物としては、例えば、

- 4, 4'-ジヒドロキシー3, 3'-ジメチルビフェニル、
- 4, 4' -ジメチルヒドロキシー3, 3', 5, 5' -テトラフルオロビフェニル、
 - 4, 4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル、
 - 4, 4-ジヒドロキシオクタフルオロビフェニル、
 - 3, 3'-ジアリルー4, 4'-ビス(4-ヒドロキシ)ビフェニル、
 - 4,4'-ジクロロー2,2'-トリフルオロメチルビフェニル、
 - 4,4'-ジブロモー2,2'-トリフルオロメチルビフェニル、
 - 4, 4'-ジョードー2, 2'-トリフルオロメチルビフェニル、

ビス(4 - クロロフェニル)スルフォン、ビス(4 - ヒドロキシフェニル)スルフォン、

ビス(4 - クロロフェニル)エーテル、ビス(4 - ヒドロキシフェニル)エーテル、

- 4, 4'-ジクロロベンゾフェノン、4, 4'-ジヒドロキシベンゾフェノン、
- 2,4-ジクロロベンゾフェノン、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン などを挙げることができる。

上記ビスフェノール化合物はナトリウム、カリウムなどを含有する塩基性化合物によって、水酸基を-OM基(Mはアルカリ金属である)に置換させても良い。

前記一般式(13)に示す化合物は、1種単独で又は2種以上を組み合わせて 用いることができる。

一般式(14)

【化16】

[0047]

[-般式(14)中、 R^{11} は、炭素数 $1\sim20$ の炭化水素基、シアノ基、ニトロ

基、炭素数 $1\sim 2$ 0のアルコキシル基、アリール基またはハロゲン原子、 R^{14} 、 R^{15} は、 $-OSO_2Z$ (ここで、Zはアルキル基、ハロゲン化アルキル基または アリール基を示す。)、塩素原子、臭素原子または沃素原子を示し、fは0~4の整数を示す。〕

[0048]

前記一般式(14)に示す化合物としては、例えば、

1.2-ジヒドロキシベンゼン、1.3-ジヒドロキシベンゼン、1.4-ジヒ ドロキシベンゼン、2,3-ジヒドロキシトルエン、2,5-ジヒドロキシトル エン、2,6-ジヒドロキシトルエン、3,4-ジヒドロキシトルエン、3,5 ジヒドロキシトルエン、oージクロロベンゼン、oージブロモベンゼン、oー ジヨードベンゼン、 o - ジメチルスルフォニロキシベンゼン、 2, 3 - ジクロロ トルエン、2,3-ジブロモトルエン、2,3-ジヨードトルエン、3,4-ジ クロロトルエン、3,4-ジブロモトルエン、3,4-ジヨードトルエン、2, 3-ジメチルスルフォニロキシベンゼン、3,4-ジメチルスルフォニロキシベ ンゼン、m-ジクロロベンゼン、m-ジブロモベンゼン、m-ジヨードベンゼン 、m-ジメチルスルフォニロキシベンゼン、2,4-ジクロロトルエン、2,4 ージブロモトルエン、2、4ージヨードトルエン、3、5ージクロロトルエン、 3, 5-ジブロモトルエン、3, 5-ジヨードトルエン、2, 6-ジクロロトル エン、2,6-ジブロモトルエン、2,6-ジヨードトルエン、3,5-ジメチ ルスルフォニロキシトルエン、2,6-ジメチルスルフォニロキシトルエン、2 **,4-ジクロロベンゾトリフルオライド、2,4-ジブロモベンゾトリフルオラ** イド、2,4-ジヨードベンゾトリフルオライド、3,5-ジクロロベンゾトリ フルオライド、3, 5-ジブロモトリフルオライド、3, 5-ジヨードベンゾト リフルオライド、1,3ージブロモー2,4,5,6ーテトラフルオロベンゼン 、2,4-ジクロロベンジルアルコール、3,5-ジクロロベンジルアルコール 、2、4-ジブロモベンジルアルコール、3,5-ジブロモベンジルアルコール 、 3 、 5 ージクロロフェノール、 3 、 5 ージブロモフェノール、 3 , 5 ージクロ ローtーブトキシカルボニロキシフェニル、3,5-ジブロモーtーブトキシカ ルボニロキシフェニル、2,4ージクロロ安息香酸、3,5ージクロロ安息香酸 、2,4-ジブロモ安息香酸、3,5-ジブロモ安息香酸、2,4-ジクロロ安息香酸メチル、3,5-ジクロロ安息香酸メチル、3,5-ジブロモ安息香酸メチル、2,4-ジクロロ安息香酸ーt-ブチル、3,5-ジクロロ安息香酸ーt-ブチル、3,5-ジブロモ安息香酸ーt-ブチル、3,5-ジブロモ安息香酸ーt-ブチル、3,5-ジブロモ安息香酸ーt-ブチル。3,5-ジブロモ安息香酸ーt-ブチルなどを挙げることもできる。

上記ビスフェノール化合物はナトリウム、カリウムなどを含有する塩基性化合物によって、水酸基を-OM基(Mはアルカリ金属である)に置換させても良い。

前記一般式(14)に示す化合物は、1種単独で又は2種以上を組み合わせて 用いることができる。

一般式(2)で表される重合体中の繰り返し構造単位の割合は、上記一般式(2)において、jは0~100モル%、kは0~100モル%(ただし、j+k=100モル%)である。

[0049]

一般式(2)で表されるの重合体の合成方法として、ビスフェノール化合物と ジハロゲン化化合物をアルカリ金属化合物の存在下で、溶剤中で加熱することに より得られる。

上記ビスフェノール化合物とジハロゲン化化合物の使用割合は、ビスフェノール化合物が $45\sim55$ モル%、好ましくは $48\sim52$ モル%、ジハロゲン化化合物が $55\sim45$ モル%、好ましくは $52\sim48$ モル%である。ビスフェノール化合物の使用割合が45 未満や55 を越えると重合体の分子量が上昇しにくく、塗膜の塗布性が劣る場合がある。

この際使用するアルカリ金属化合物としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水素化リチウム、金属ナトリウム、金属カリウム、金属リチウムなどを挙げることができる。

これらは、1種または2種以上を同時に使用しても良い。

アルカリ金属化合物の使用量は、ビスフェノール化合物に対して、通常、100 ~400モル%、好ましくは100~250モル%である。 また、反応を促進させるため、金属銅、塩化第一銅、塩化第二銅、臭化第一銅、 、臭化第二銅、ヨウ化第一銅、ヨウ化第二銅、硫酸第一銅、硫酸第二銅、酢酸第 一銅、酢酸第二銅、ギ酸第一銅、ギ酸第二銅などの助触媒を使用しても良い。

この助触媒の使用量は、ビスフェノール化合物に対し、通常、1~50モル% 、好ましくは1~30モル%である。

[0050]

反応に使用する溶剤としては、例えばピリジン、キノリン、ベンゾフェノン、ジフェニルエーテル、ジアルコキシベンゼン(アルコキシル基の炭素数は $1\sim4$)、トリアルコキシベンゼン(アルコキシル基の炭素数は $1\sim4$)、ジフェニルスルホン、ジメチルスルホキシド、ジメチルスルホン、ジエチルスルホキシド、ジエチルスルホン、ジイソプロピルスルホン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロチオフェン、スルホラン、N-メチル-2-ピロリドン、N-エチル-2-ピロリドン、ジメチルイミダゾリジノン、 $\gamma-$ ブチロラクトン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどを使用することができる。

これらは、1種または2種以上を同時に使用しても良い。

一般式(2)で表される重合体を合成する際の反応濃度としては、モノマーの 重量を基準として、2~50重量%、反応温度としては50~250℃である。

また、重合体合成時に生じる金属塩や未反応モノマーを除去するため、反応溶液を3過することや反応溶液を重合体に対して貧溶剤である溶媒により再沈殿や酸性、アルカリ性水溶液により洗浄することが好ましい。

このようにして得られる一般式(2)で表される重合体のGPC法による重量平均分子量は、通常、500~500,000、好ましくは800~100,0000である。

[0051]

(B) 有機溶剤

本発明の膜形成用組成物は、(A)成分を、(B)有機溶剤に溶解または分散 してなる。

本発明に使用する(B)有機溶剤としては、例えば、n-ペンタン、i-ペンタン、n-ヘキサン、i-ヘキサン、n-ヘプタン、i-ヘプタン、2, 2, 4

ートリメチルペンタン、n-オクタン、i-オクタン、シクロヘキサン、メチル シクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素系溶媒;ベンゼン、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、トリメチルベンゼン、メチルエチルベンゼン、n-プロピルベ ンセン、i-プロピルベンセン、ジエチルベンゼン、i-ブチルベンゼン、トリ エチルベンゼン、ジーiープロピルベンセン、n-アミルナフタレン、トリメチ ルベンゼンなどの芳香族炭化水素系溶媒;メタノール、エタノール、nープロパ ノール、iープロパノール、nーブタノール、iーブタノール、secーブタノ ール、t-ブタノール、n-ペンタノール、i-ペンタノール、2-メチルブタ ノール、sec-ペンタノール、t-ペンタノール、3-メトキシブタノール、 n-ヘキサノール、2-メチルペンタノール、sec-ヘキサノール、2-エチ ルブタノール、sec-ヘプタノール、ヘプタノールー3、n-オクタノール、 2-エチルヘキサノール、sec-オクタノール、n-ノニルアルコール、2, 6-ジメチルヘプタノール-4、n-デカノール、sec-ウンデシルアルコー ル、トリメチルノニルアルコール、sec-テトラデシルアルコール、sec-ヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘキサノール、メチルシクロヘキ サノール、3,3,5ートリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、 フェニルメチルカルビノール、ジアセトンアルコール、クレゾールなどのモノア N ルコール系溶媒:エチレングリコール、1, 2 ープロピレングリコール、1, 3 ーブチレングリコール、ペンタンジオールー2,4、2-メチルペンタンジオー ルー2, 4、ヘキサンジオールー2, 5、ヘプタンジオールー2, 4、2ーエチ ルヘキサンジオールー1,3、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール 、トリエチレングリコール、トリプロピレングリコール、グリセリンなどの多価 アルコール系溶媒;アセトン、メチルエチルケトン、メチルー n ープロピルケト ン、メチルーn-ブチルケトン、ジエチルケトン、メチルーi-ブチルケトン、 メチルーnーペンチルケトン、エチルーnーブチルケトン、メチルーnーヘキシ ルケトン、ジーi-ブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサノン、2 -ヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2,4-ペンタンジオン、アセトニル アセトン、ジアセトンアルコール、アセトフェノン、フェンチョンなどのケトン 系溶媒:エチルエーテル、iープロピルエーテル、nーブチルエーテル、nーヘ

キシルエーテル、2-エチルヘキシルエーテル、エチレンオキシド、1,2-プ ロピレンオキシド、ジオキソラン、4-メチルジオキソラン、ジオキサン、ジメ チルジオキサン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール モノエチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコー ルモノーn-ブチルエーテル、エチレングリコールモノ-n-ヘキシルエーテル 、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノー2-エ チルブチルエーテル、エチレングリコールジブチルエーテル、ジエチレングリコ ールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレ ングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノーnーブチルエーテ ル、ジエチレングリコールジーnーブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ ーn-ヘキシルエーテル、エトキシトリグリコール、テトラエチレングリコール ジーn-ブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレ ングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル 、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチ ルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、トリプロピレングリ コールモノメチルエーテル、テトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラ ンなどのエーテル系溶媒:ジエチルカーボネート、酢酸メチル、酢酸エチル、γ ーブチロラクトン、ァーバレロラクトン、酢酸n-プロピル、酢酸i-プロピル 、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、酢酸sec-ブチル、酢酸n-ペンチル、 酢酸sec-ペンチル、酢酸3-メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2 ーエチルブチル、酢酸2ーエチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢酸シクロヘキシル 、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸n-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸 エチル、酢酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジエ チレングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノーn-ブ チルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸プロピレン グリコールモノエチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢酸ジプロピレングリコー ルモノメチルエーテル、酢酸ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢

酸グリコール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エチル、プロピオン酸n-ブチル、プロピオン酸i-アミル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジーn-ブチル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチルなどのエステル系溶媒;N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルアセトアミド、N-メチルアセトアミド、N-メチルプロピオンアミド、N-メチルピロリドンなどの含窒素系溶媒;硫化ジメチル、硫化ジエチル、チオフェン、テトラヒドロチオフェン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、1, 3-プロパンスルトンなどの含硫黄系溶媒などを挙げることができる。

これらの溶剤は、1種単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることができる。

[0052]

その他の添加剤

本発明の膜形成用組成物には、さらにコロイド状シリカ、コロイド状アルミナ、(A)成分以外の有機ポリマー、界面活性剤、シランカップリング剤、トリアゼン化合物、ラジカル発生剤、重合性の二重結合を含有する化合物、重合性の三重結合などの成分を添加してもよい。

コロイド状シリカとは、例えば、高純度の無水ケイ酸を前記親水性有機溶媒に分散した分散液であり、通常、平均粒径が $5\sim30\,\mathrm{m}\,\mu$ 、好ましくは $10\sim20\,\mathrm{m}\,\mu$ 、固形分濃度が $10\sim40$ 重量%程度のものである。このような、コロイド状シリカとしては、例えば、日産化学工業(株)製、メタノールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾル;触媒化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられる。

コロイド状アルミナとしては、日産化学工業(株)製のアルミナゾル520、同100、同200;川研ファインケミカル(株)製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル10、同132などが挙げられる。

上記有機ポリマーとしては、例えば、糖鎖構造を有する重合体、ビニルアミド 系重合体、(メタ)アクリル系重合体、芳香族ビニル化合物系重合体、デンドリ マー、ポリイミド、ポリアミック酸、ポリアミド、ポリキノキサリン、ポリオキ サジアゾール、フッ素系重合体、ポリアルキレンオキサイド構造を有する重合体 などを挙げることができる。

[0053]

ポリアルキレンオキサイド構造を有する重合体としては、ポリメチレンオキサイド構造、ポリエチレンオキサイド構造、ポリプロピレンオキサイド構造、ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキシド構造などを有する重合体が挙げられる。

具体的には、ポリオキシメチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエテチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンラノリン誘導体、アルキルフェノールホルマリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルなどのエーテル型化合物、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンがリコール脂肪酸エステル、エチレングリコール脂肪酸エステル、脂肪酸モノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、カリエチレングリコール脂肪酸エステル、カリエチレングリコール脂肪酸エステル、脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエーテルエステル型化合物などを挙げることができる。

ポリオキシチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマーとしては、下記のようなブロック構造を有する化合物が挙げられる。

- -(X')p (Y')q -
- -(X')p-(Y')q-(X')r-

[一般式中、X' は-CH2 CH2 O-で表される基を、Y' は-CH2 CH(CH3) O-で表される基を示し、pは $1\sim90$ 、qは $10\sim99$ 、rは $0\sim90$ の数を示す。]

[0054]

これらの中で、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、などのエーテル型化合物をより好ましい例として挙げることができる。

これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

[0055]

界面活性剤としては、例えば、ノニオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、フッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、ポリアルキレンオキシド系界面活性剤、ポリ(メタ)アクリレート系界面活性剤などを挙げることができ、好ましくはブッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤を挙げることができる。

[0056]

フッ素系界面活性剤としては、例えば、1,1,2,2ーテトラフロロオクチル(1,1,2,2ーテトラフロロプロピル)エーテル、1,1,2,2ーテトラフロロオクチルへキシルエーテル、オクタエチレングリコールジ(1,1,2,2ーテトラフロロブチル)エーテル、ヘキサエチレングリコール(1,1,2,2ーテトラフロロブチル)エーテル、ヘキサエチレングリコール(1,1,2,2,3,3ーへキサフロロペンチル)エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ(1,1,2,2ーテトラフロロブチル)エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ(1,1,2,2,3,3ーへキサフロロペンチル)エーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、1,1,2,2,8,8,9,9,10,10ーデカフロロドデカン、1,1,2,2,3,3ーへキサフロロデカン、Nー[3ー(パーフルオロオクタンスルホンアミド)プロピル]ーN,N'ージメチルーNーカルボキシメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、パーフルオロアルキルーNーエチルスルホニルグリシン塩、リン酸ビス(NーパーフルオロオクチルスルホニルーNーエチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキルエチルリン酸エステルなどの末端、主鎖および側鎖の少なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまた

はフルオロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面活性剤を挙げることができる。

また、市販品としては、メガファックF142D、同F172、同F173、同F183 [以上、大日本インキ化学工業(株)製]、エフトップEF301、同303、同352 [新秋田化成(株)製]、フロラードFC-430、同FC-431 [住友スリーエム(株)製]、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-105、同SC-106 [旭硝子(株)製]、BM-1000、BM-1100 [裕商(株)製]、NBX-15 [(株)ネオス] などの名称で市販されているフッ素系界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上記メガファックF172、BM-1000、BM-1100、NBX-15が特に好ましい。

シリコーン系界面活性剤としては、例えば、SH7PA、SH21PA、SH30PA、ST94PA [いずれも東レ・ダウコーニング・シリコーン (株) 製] などを用いることができる。これらの中でも、上記SH28PA、SH30PAが特に好ましい。

界面活性剤の使用量は、(A)成分100重量部に対して、通常、0.000 01~1重量部である。

これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

[0057]

シランカップリング剤としては、例えば、3-グリシジロキシプロピルトリメトキシシラン、3-アミノグリシジロキシプロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリシジロキシプロピルメチルジメトキシシラン、1-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、2-アミノプロピルトリメトキシシラン、2-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリメトキシシラン、

N-x++2カルボニルー3-y=1プロピルトリメトキシシラン、N-x++2シカルボニルー3-y=1プロピルトリエトキシシラン、N-hリエトキシシリルプロピルトリエチレントリアミン、N-hリエトキシシリルプロピルトリエチレントリアミン、10-hリメトキシシリルー1, 4, 7-hリアザデカン、10-hリエトキシシリルー1, 4, 7-hリアザデカン、10-hリエトキシシリルー1, 10-hリアザデカン、10-hリエトキシシリルー1, 10-hリアザデカン、10-hリエトキシシリルー1, 10-hリアザデカン、10-hリエトキシシリルー1, 10-hリアサアサノニルアセテート、10-hリアサアカン、10-hリエトキシシリルー10-hリエトキシシラン、10-hリエトキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシラン、10-hリストキシシランなどが挙げられる。

これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

[0058]

トリアゼン化合物としては、例えば、1,2-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、1,3-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、1,4-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフェニル)エーテル、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフェニル)スルホン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフェニル)スルホン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフェニル)フェニル)フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニルフェノキシ)フェニル。 1,1,3,3,3-ベキサフルオロプロパン、2,2-ビス〔4-(3,3-ジメチルトリアゼニルフェノキシ)フェニル。 1,3,5-トリス(3,3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、2,7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 フルオレン、2,7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 フルオレン、2,7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 7,5-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル。 3,3-ジメ

チルトリアゼニル) -9, 9-ビス [3-プロペニルー4-(3,3-ジメチルトリアゼニル) フェニル] フルオレン、2, <math>7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル) -9, 9-ビス[3-フルオロー4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)) フェニル] フルオレン、2, 7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル) -9, 9-ビス[3,5-ジフルオロー4-(3,3-ジメチルトリアゼニル) フェニル] フルオレン、2, <math>7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル) -9, 9-ビス[3-トリフルオロメチルー4-(3,3-ジメチルトリアゼニル) フェニル] フルオレンなどが挙げられる。

これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

[0059]

ラジカル発生剤としては、例えば、イソブチリルパーオキサイド、α, α' ービ ス(ネオデカノイルパーオキシ)ジイソプロピルベンゼン、クミルパーオキシネ オデカノエート、ジーnプロピルパーオキシジカーボネート、ジイソプロピルパ ーオキシジカーボネート、1,1,3,3ーテトラメチルブチルパーオキシネオ デカノエート、ビス(4-t-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネー ト、1-シクロヘキシル-1-メチルエチルパーオキシネオデカノエート、ジー 2-エトキシエチルパーオキシジカーボネート、ジ(2-エチルヘキシルパーオ キシ)ジカーボネート、t-ヘキシルパーオキシネオデカノエート、ジメトキブ チルパーオキシジカーボネート、ジ(3-メチル-3-メトキシブチルパーオキ シ)ジカーボネート、tーブチルパーオキシネオデカノエート、2,4-ジクロ ロベンゾイルパーオキサイド、tーヘキシルパーオキシピバレート、tーブチル パーオキシピバレート、3,5,5-トリメチルヘキサノイルパーオキサイド、 オクタノイルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド、ステアロイルパーオ キサイド、1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチルパーオキシ2ーエチルヘキサノ エート、スクシニックパーオキサイド、2,5-ジメチルー2,5-ジ(2-エ チルヘキサノイルパーオキシ)ヘキサン、1-シクロヘキシル-1-メチルエチ ルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、t-ヘキシルパーオキシ2-エチルヘ キサノエート、t-ブチルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、m-トルオイ ルアンドベンゾイルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、t-ブチルパ

ーオキシイソブチレート、ジーt-ブチルパーオキシー2-メチルシクロヘキサ ン、1、1-ビス(t-ヘキシルパーオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロ ヘキサン、1, 1 - ビス(t - ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1, 1 -1 - ビス(t - ブチルパーオキシ)シクロヘキサン、2, 2 - ビス(4, 4 - ジ - t - ブチルパーオキシシクロヘキシル)プロパン、1, 1 - ビス(t - ブチル パーオキシ)シクロデカン、t-ヘキシルパーオキシイソプロピルモノカーボネ ート、tーブチルパーオキシマレイン酸、tーブチルパーオキシー3,3,5-トリメチルヘキサノエート、tーブチルパーオキシラウレート、2,5ージメチ ル-2, 5-ジ (m-トルオイルパーオキシ) ヘキサン、t-ブチルパーオキシ イソプロピルモノカーボネート、t ーブチルパーオキシ2 - エチルヘキシルモノ カーボネート、t - ヘキシルパーオキシベンゾエート、2, 5 - ジメチルー2, 5-ジ(ベンゾイルパーオキシ)へキサン、t-ブチルパーオキシアセテート、 2. 2-ビス(t-ブチルパーオキシ)ブタン、t-ブチルパーオキシベンゾエ ート、n-ブチル-4,4-ビス(t-ブチルパーオキシ)バレレート、ジーt -ブチルパーオキシイソフタレート、 α , α ' -ビス(t -ブチルパーオキシ) ジイソプロピルベンゼン、ジクミルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5 ージ(t -ブチルパーオキシ)ヘキサン、t -ブチルクミルパーオキサイド、ジ - t - ブチルパーオキサイド、p - メンタンヒドロパーオキサイド、2, 5 - ジ メチルー2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)ヘキシンー3、ジイソプロピルベ ンゼンヒドロパーオキサイド、t-ブチルトリメチルシリルパーオキサイド、1 , 1, 3, 3-テトラメチルブチルヒドロパーオキサイド、クメンヒドロパーオ キサイド、t-ヘキシルヒドロパーオキサイド、t-ブチルヒドロパーオキサイ ドなどの有機過酸化物;

ーテトラフェニルコハク酸ニトリルなどのビベンジル化合物を挙げることができる。

これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

[0060]

重合性の二重結合を含有する化合物としては、例えば、アリルベンゼン、ジアリルベンゼン、トリアリルベンゼン、アリルオキシベンゼン、ジアリルオキシベンゼン、トリアリルオキシベンゼン、 α ,・一ジアリルオキシアルカン類、 α ,・一ジアリルアルケン類、 α ,・一ジアリルアルケン類、アリルアミン、ジアリルアミン、トリアリルアミン、Nーアリルフタルイミド、Nーアリルピロメリットイミド、N、N'ージアリルウレア、トリアリルイソシアヌレート、2,2'ージアリルビスフェノールAなどのアリル化合物;

スチレン、ジビニルベンゼン、トリビニルベンゼン、スチルベン、プロペニルベンゼン、ジプロペニルベンゼン、トリプロペニルベンゼン、フェニルビニルケトン、メチルスチリルケトン、 α , ・一ジビニルアルカン類、 α , ・一ジビニルアルカン類、 α , ・一ジビニルアルカン類、 α , ・一ジビニルアルカン類、 α , ・一ジアクリルオキシアルカン類、 α , ・一ジアクリルアルケン類、 α , ・一ジアクリルアルケン類、 α , ・一ジメタクリルオキシアルカン類、 α , ・一ジメタクリルオキシアルカン類、 α , ・一ジメタクリルアルケン類、 α , ・一ジメタクリルアルケン類、 α , ・一ジメタクリルアルケン類、 α , ・一ジメタクリルアルケン類、ビスアクリルオキシベンゼン、トリスアクリルオキシベンゼン、ビスメタクリルオキシベンゼン、トリスメタクリルオキシベンゼン、Nービニルフタルイミド、Nービニルピロメリットイミドなどのビニル化合物;

2, 2' -ジアリル-4, 4' -ビフェノールを含むポリアリーレンエーテル、 2, 2' -ジアリル-4, 4' -ビフェノールを含むポリアリーレンなどを挙げることができる。

これらは、1種または2種以上を同時に使用しても良い。

[0061]

重合性の三重結合を含有する化合物としては、例えば、下記一般式(15)および一般式(16)で表される化合物もしくはいずれか一方が挙げられる。

[0062]

一般式(15)

【化17】

$$\begin{bmatrix} (R^{22})_1 & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{\mathbf{m}} R^{23}$$

一般式(16)

【化18】

$$\begin{bmatrix} = \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}_{n} R^{24}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

(一般式中、R23は2~m価の芳香族基を示し、R24は2~n価の芳香族基を示し、R22は炭素数1~3のアルキル基を示し、1は0~5の整数を示し、mおよびnはそれぞれ独立に2~6の整数である。)

[0064]

上記一般式 (15) において、R 2 2 は炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基であり、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基を挙げることができる。また、一般式 (15) におけるR 2 3 および一般式 (16) におけるR 2 4 は、それぞれ $2 \sim m$ 価および $2 \sim n$ 価の芳香族基であり、例えば、以下の一般式 (17) に示す基を挙げることができる。

[0065]

一般式(17)

【化19】

[0066]

〔上記一般式中、Mは-O-、-S-、-CH2 -、-C(CH3)2 -、フルオレニル基から選ばれる少なくとも1種の基を示す。〕

かかる一般式 (15) で表される化合物の具体例としては、例えば、以下の一般式 (18) ~ (29) の化合物を挙げることができる。

[0067]

一般式(18)

【化20】

一般式(19)

【化21】

一般式(20)

【化22】

一般式 (21)

【化23】

一般式 (22)

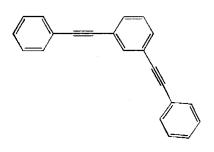
【化24】

一般式 (23)

【化25】

一般式(24)

【化26】



一般式 (25)

【化27】

一般式 (26)

【化28】

一般式 (27)

【化29】

一般式 (28)

【化30】

一般式(29)

【化31】

[0068]

また、上記一般式 (1.6) で表される化合物の具体例としては、例えば、以下一般式 (3.0) \sim (3.5) の化合物を挙げることができる。

[0069]

一般式(30)

【化32】

一般式(31)

【化33】

一般式(32)

【化34】

一般式 (33)

【化35】

一般式 (34)

【化36】

一般式 (35)

【化37】

[0070]

重合性の三重結合を含有する化合物としては、そのほか、エチニルベンゼン、ビス(トリメチルシリルエチニル)ベンゼン、トリス(トリメチルシリルエチニル)ベンゼン、トリス(トリメチルシリルエチニル)ベンゼン、ビス(トリメチルシリルエチニルフェニル)エーテル、トリメチルシリルエチニルベンゼンなどを挙げることができる。

これらの重合性の三重結合を含有する化合物は、1種または2種以上を同時に 使用しても良い。

[0071]

本発明に使用する溶液の全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり

、使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性もより優れるものである。

[0072]

本発明の組成物を、シリコンウエハ、Si〇₂ウエハ、SiNウエハなどの基材に塗布する際には、スピンコート、浸漬法、ロールコート法、スプレー法などの塗装手段が用いられる。

[0073]

この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗りで厚さ0.05~1.5μm程度、2回塗りでは厚さ0.1~3μm程度の塗膜を形成することができる。その後、常温で乾燥するか、あるいは80~600℃程度の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥することにより、層間絶縁膜となる塗膜(硬化膜)を形成することができる。この際の加熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーネスなどを使用することができ、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行うことができる。

また、電子線や紫外線を照射することによっても、塗膜を形成させることができる。

[0074]

このようにして得られる化学機械研磨ストッパー膜は、CMP処理に対する耐性に優れることから、LSI、システムLSI、DRAM、SDRAM、RDRAM、D-RDRAMなどの半導体素子用途に有用である。

[0075]

【実施例】

以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明する。

なお、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量 部および重量%であることを示している。

また、実施例中における膜形成用組成物の評価は、次のようにして測定したものである。

[0076]

重量平均分子量(Mw)

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) 法により 測定した。

試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、試料1gを、100ccのテトラヒドロフランに溶解して調製した。

標準ポリスチレン:米国プレッシャーケミカル社製の標準ポリスチレンを使用 した。

装置:米国ウオーターズ社製の高温高速ゲル浸透クロマトグラム(モデル150-C ALC/GPC)

カラム:昭和電工(株)製のSHODEX A-80M(長さ50cm)

測定温度:40℃

流速:1 c c/分

[0077]

CMP耐性

塗膜を以下の条件でCMP研磨した。

スラリー:シリカー過酸化水素系

研磨圧力: 400g/cm²

研磨時間:180秒

CMP前後での塗膜の膜厚変化と35万ルクスの表面観察用ランプでの外観検査から下記基準で評価した。

〇:膜厚変化2%以下で塗膜に傷や剥がれが確認されない

×:膜厚変化が2%越える、あるいは塗膜に傷や剥がれが確認される

[0078]

合成例1

三つ口フラスコに、ヨウ化ナトリウム 7.5 g、無水塩化ニッケル 1.3 g、トリフェニルホスフィン 15.7 g、酢酸により活性化させた亜鉛粉末 19.6 g、および 9,9 - ビス (メチルスルフォニロキシ) フルオレン 16.7 gを加え、24時間、真空下で乾燥したのち、三つ口フラスコ内をアルゴンガスで充填した。次いで、乾燥 N,N-ジメチルアセトアミド 50 m 1、乾燥テトラヒドロ

フラン50m1、および2,4-ジクロロトルエン10.8gを添加し、70℃ アルゴン気流下で攪拌したところ、反応液が褐色となった。そのまま、70℃で 20時間反応させたのち、反応液を36%塩酸400mlおよびメタノール1, 600ml混合液中に注ぎ、沈殿物を回収した。

得られた沈殿物を、クロロホルム中に加えて懸濁させ、2規定塩酸水溶液で抽出を行ったのち、クロロホルム層をメタノールに注ぎ、沈殿物を回収、乾燥したところ、重量平均分子量10,300の白色粉末状の重合体①を得た。

[0079]

合成例2

窒素導入管、ディーンスターク、冷却管を取り付けた1 Lの三口フラスコに、9,9ービス(4ーヒドロキシフェニル)フルオレン26.48g、9,9ービス(4ーヒドロー3ーメチルキシフェニル)フルオレン28.35g、無水炭酸カリウム45.60g、ジメチルアセトアミド500mL、トルエン150mLをくわえ、窒素雰囲気下140℃で3時間加熱を行った。塩形成時に生成する水および過剰のトルエンを除去した後、反応溶液を室温まで冷却した。その後この反応液に4,4 'ージフルオロベンゾフェノン32.73gを添加し、165℃で10時間反応させた。冷却後、反応液を10%HC1含有メタノール5Lに投じ再沈殿を行った。この沈殿物を濾過、イオン交換水で十分に洗浄した後、真空オーブンにて予備乾燥した。テトラヒドロフランにこの沈殿物を再溶解させ、不溶部を除去した後、メタノールに再沈殿させた。この再沈殿操作をもう一度繰り返すことによりポリマーを精製し、乾燥は真空オーブン中80℃で12時間行った。重量平均分子量150000のの自色粉末状の重合体②を得た。

合成例3

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン77.04gとテトラメトキシシラン24.05gとテトラキス(アセチルアセトナート)チタン 0.48gを、プロピレングリコールモノプロピルエーテル290gに溶解させ たのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を60℃に安定させた。次に、イオン交換水84gを1時間かけて溶液に添加した。その後、60℃で2時間 反応させたのち、アセチルアセトン25gを添加し、さらに30分間反応させ、

反応液を室温まで冷却した。50℃で反応液からメタノールと水を含む溶液を149gエバポレーションで除去し、反応液①を得た。

このようにして得られた加水分解縮合物(加水分解物およびその縮合物もしくはいずれか一方)の重量平均分子量は、8,900であった。

実施例1

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて反応液①を塗布し、ホットプレート上で100℃で1分間、さらに420℃の窒素雰囲気のオーブン中で30分間基板を焼成し、基板Aを得た。この際の塗膜の膜厚は500nmに調整した。

合成例1で得られた重合体①2g、2、3ージメチルー2、3ージフェニルブタン0.1g、1、3、5ートリエチニルベンゼン0.2gをシクロヘキサノン18gに溶解させ0.2μm孔径のテフロン製フィルターでろ過した。この溶液を基板A上に、スピンコート法を用いて膜厚100nmとなるように塗布し、ホットプレート上で100℃で2分間、さらに420℃の窒素雰囲気のオーブン中で30分間基板を焼成した。

この基板のCMP耐性を評価したところ、CMP前後での塗膜の膜厚変化は0.5%であった。また、CMP後も基板に傷や剥がれは認められなかった。

実施例2

合成例 2 で得られた重合体② 2 g、 2, 3 ージメチルー 2, 3 ージフェニルブ タン 0. 1 g、 1, 3, 5 ートリエチニルベンゼン 0. 2 gをシクロヘキサノン 1 8 gに溶解させ 0. 2 μ m 孔径のテフロン製フィルターでろ過した。この溶液 を実施例 1 と同様な操作で得られた基板 A上に、スピンコート法を用いて膜厚 1 0 0 n m となるように塗布し、ホットプレート上で 1 0 0 $\mathbb C$ で 2 分間、さらに 4 2 0 $\mathbb C$ の 窒素雰囲気のオーブン中で 3 0 分間基板を焼成した。

この基板のCMP耐性を評価したところ、CMP前後での塗膜の膜厚変化はO.8%であった。また、CMP後も基板に傷や剥がれは認められなかった。

実施例3

実施例1と同様な操作で得られた基板A上に、市販のポリアリーレンエーテル 溶液商品名SiLK I (Dow Chemical社製)をスピンコート法で 膜厚100nmとなるように塗布し、ホットプレート上で100℃で2分間、さらに420℃の窒素雰囲気のオーブン中で30分間基板を焼成した。

この基板のCMP耐性を評価したところ、CMP前後での塗膜の膜厚変化は0.6%であった。また、CMP後も基板に傷や剥がれは認められなかった。 実施例4

実施例1と同様な操作で得られた基板A上に、市販のポリアリーレンエーテル溶液商品名FLARE 2. 0 (Honeywell社製)をスピンコート法で膜厚100nmとなるように塗布し、ホットプレート上で100℃で2分間、さらに420℃の窒素雰囲気のオーブン中で30分間基板を焼成した。

この基板のCMP耐性を評価したところ、CMP前後での塗膜の膜厚変化は0.7%であった。また、CMP後も基板に傷や剥がれは認められなかった。 実施例5

実施例1において、基板Aの代わりに膜厚500nmのCVD-TEOS膜付き基板を使用したこと以外は、実施例1と同様に評価を行った。

この基板のCMP耐性を評価したところ、CMP前後での塗膜の膜厚変化は0.7%であった。また、CMP後も基板に傷や剥がれは認められなかった。 実施例6

この基板のCMP耐性を評価したところ、CMP前後での塗膜の膜厚変化はO. 7%であった。また、CMP後も基板に傷や剥がれは認められなかった。

比較例1

実施例1で得られた基板Aを直接CMP処理したこと以外は実施例1と同様にして評価を行った。

CMP前後での膜厚変化は5%であり、CMP後の塗膜で多数の傷が観察された

実施例6のBlackDiamond膜(Applied Materials 社製CVD装置で製膜したカーボンドープSiO₂膜)付き基板を直接CMP処理したこと以外は実施例1と同様にして評価を行った。

CMP前後での膜厚変化は4%であり、CMP後の塗膜で数個の傷が観察された。

[0080]

【発明の効果】

本発明によれば、(A) 芳香族ポリアリーレンおよび芳香族ポリアリーレンエーテルもしくはいずれか一方ならびに(B) 有機溶剤を含有する溶液を塗布並びに焼成することにより得られる化学機械研磨ストッパー膜を使用することにより、CMP処理によるダメージの少ない半導体用塗膜(層間絶縁膜用材料)を提供することが可能である。

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜やバリア膜のCMP処理によるダメージを低減する塗膜を提供すること。

【解決手段】 (A) 芳香族ポリアリーレンおよび/または芳香族ポリアリーレンエーテル、(B) 有機溶剤を含有する溶液を塗布並びに焼成することにより得られる化学機械研磨ストッパー膜。

【選択図】

なし

特2000-257536

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2000-257536

受付番号

50001089407

書類名

特許願

担当官

宇留間 久雄

7277

作成日

平成12年 8月30日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成12年 8月28日

出願人履歴情報

識別番号

[000004178]

1. 変更年月日

1997年12月10日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都中央区築地2丁目11番24号

氏 名

ジェイエスアール株式会社